Search Notes				

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
09/776,191	MADISON ET AL.
Examiner	Art Unit
Yong D. Pak	1652.

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
435	212	1/4/2007	· YP
435	440	1/4/2007	YP
435	252.3	1/4/2007	YP
435	320.1	1/4/2007	YP
536	23.2	1/4/2007	YP
536	23.7	1/4/2007	YP .

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
		-		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	<u> </u>			
		· 		

SEARCH NO (INCLUDING SEARC)
	DATE	EXMR
stn/east: updated search	1/4/2007	YP
inventor search	1/4/2007	ΥP
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
•		
•		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		